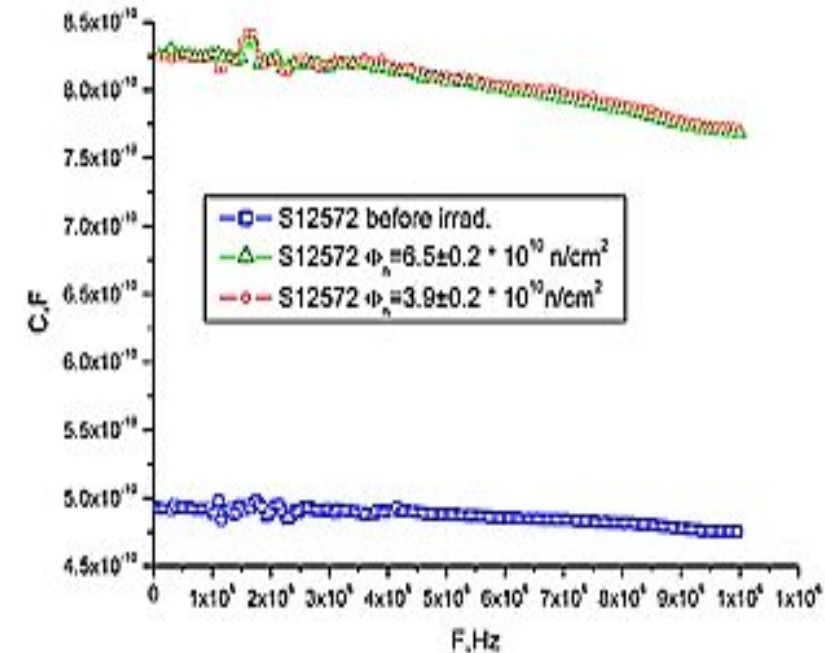
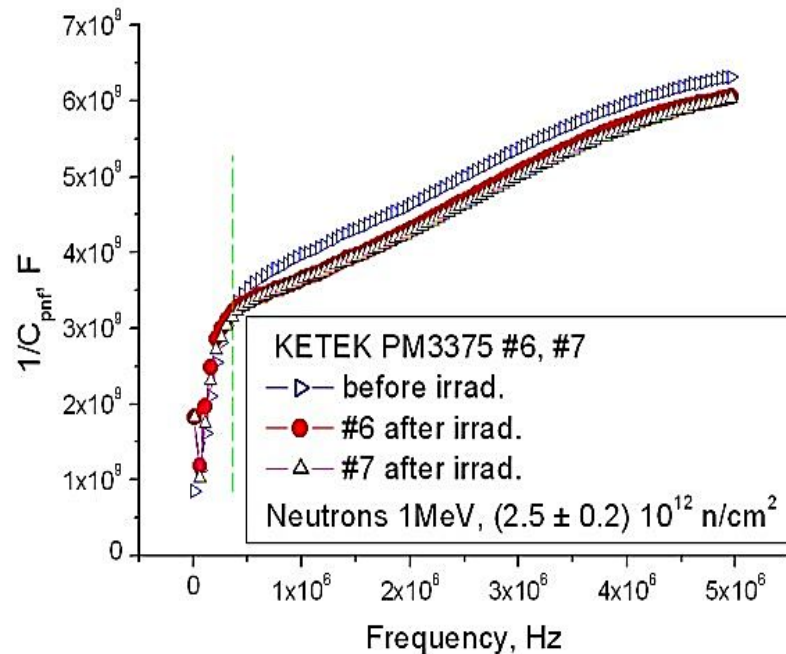
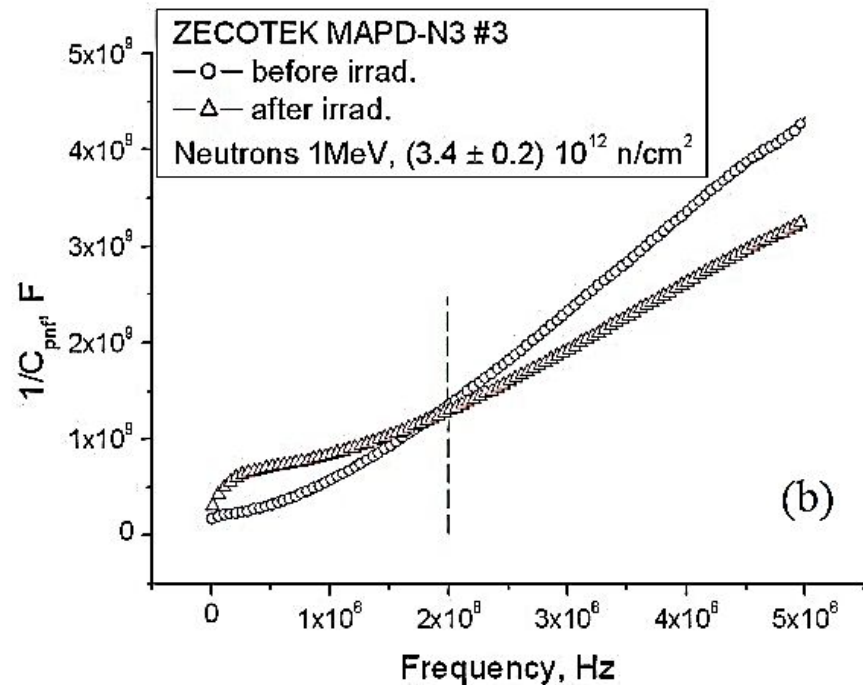


Особенности анализа частотной характеристики

$$\frac{\partial \Delta n}{\partial t} = \frac{1}{e} \cdot \frac{\partial J_n}{\partial x} + \frac{\Delta n}{\tau} \quad (1)$$

$$\frac{1}{C}(f) = \frac{1}{e} \cdot \frac{\langle \tau \rangle}{\langle N_l \rangle} \cdot \Delta \varphi \cdot f \quad (2)$$



C-F кривые Zecotek (слева), Ketek (центр) и Hamamatsu до и после облучения